. .

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-335677

(43) Date of publication of application: 04.12.2001

(51)Int.CI.

C08L 63/00 C08K 3/00 C08K 3/04 H01L 23/29 H01L 23/31

(21)Application number: 2000-108057

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

10.04.2000

(72)Inventor: TAKEMIYA KEIZO

ABE HIDENORI

(30)Priority

Priority number: 11263856

Priority date: 17.09.1999

Priority country: JP

2000083233

21.03.2000

JP

(54) EPOXY RESIN COMPOSITION FOR SEALING, AND ELECTRONIC PARTS DEVICE (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an epoxy resin composition for sealing having excellent laser marking property and electric characteristics together with good moldability which can be fabricated into an electronic parts device with narrow gaps between pads or wires without occurrence of rejected article from short circuit due to electroconductive materials also with high reliability and excellent appearance of the surface of the package.

SOLUTION: This epoxy resin composition comprises as the indispensable components (A) an epoxy resin, (B) a curing agent, (C) non-electroconductive carbon, and (D) an inorganic filler. This electronic parts device is equipped with elements sealed by the epoxy resin composition.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-335677 (P2001-335677A)

(43)公開日 平成13年12月4日(2001.12.4)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
CO8L 63/00		C 0 8 L 63/00	C 4J002
C08K 3/00		C08K 3/00	4M109
3/04		3/04	
H01L 23/29		H 0 1 L 23/30	R
23/31			
		審查請求 未請求	請求項の数4 OL (全 9 頁)
(21)出願番号	特顧2000-108057(P2000-108057)	(71)出願人 00000445	55
		日立化成	工業株式会社
(22)出願日	平成12年4月10日(2000.4.10)	東京都新	宿区西新宿2丁目1番1号
		(72)発明者 武宮 慶	三
(31)優先権主張番号	特願平11-263856	茨城県結	城市大字鹿穰1772-1 日立化成
(32)優先日	平成11年9月17日(1999.9.17)	工業株式	会社下館事業所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 阿部 秀	則
(31)優先権主張番号	特願2000-83233 (P2000-83233)	茨城県結	城市大字鹿窪1772-1 日立化成
(32)優先日	平成12年3月21日(2000.3.21)	工業株式	会社下館事業所内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(74)代理人 10007155	59
		弁理士	若林 邦彦
		- 3	a 4

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 封止用エポキシ樹脂組成物及び電子部品装置

(57)【要約】

【課題】レーザーマーク性や電気特性に優れ、バッド間やワイヤー間距離が狭い電子部品装置においても、導電性物質によるショート不良が発生せず、かつ成形性、信頼性、バッケージ表面の外観に優れた封止用エポキシ樹脂組成物及びそれを用いた電子部品装置を提供する。

【解決手段】(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、

(C) 非導電性カーボン及び(D) 無機充填材を必須成分とする封止用エポキシ樹脂組成物、及びこの封止用エポキシ樹脂組成物により封止された素子を備えた電子部品装置。

ı

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、

(C) 非導電性カーボン及び(D) 無機充填材を必須成分とする封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項2】非導電性カーボンの電気抵抗が10¹Ω以上である請求項1記載の封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項3】非導電性カーボンの含有量が、樹脂組成物 全体の0.1~10重量%である請求項1又は請求項2 記載の封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項4】請求項1~3のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂組成物により封止された素子を備えた電子部品装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザーマーク性、電気特性、成形性、信頼性及びパッケージ表面の外観に優れた封止用エポキシ樹脂組成物及びこれにより封止された素子を備えた電子部品装置に関する。

[0002]

【従来の技術】IC、LSI等の半導体素子は、素子の 集積度の向上と共に、素子のパッケージに対する占有体 積の拡大、半導体装置等の電子部品装置の小型化、薄型 化、多ピン化が進んでいる。さらに、電子機器の小型 化、薄型化に対応し、実装方法も高密度実装を可能とす る表面実装方式がピン挿入型方式に代わり、急速に普及 している。その結果、電子部品装置を基板へ取り付ける 時に、電子部品装置自体が短時間の内に200℃以上の 半田浴といった高温に曝される。この時、封止材中に含 まれる水分が気化し、ここで発生する蒸気圧が封止材と 素子、リードフレーム等のインサートとの界面において 剥離応力として働き、封止材とインサートとの間で剥離 が発生し、特に薄型の電子部品装置においては、電子部 品装置のフクレやクラックに至ってしまう。このような 剥離起因によるフクレ、クラックの防止策として、素子 表面又はリードフレームのアイランド裏面にコート材を 用いて封止材との密着性を向上させる手法、リードフレ ームのアイランド裏面にディンプル加工やスリット加工 等を行なう、あるいはLOC (Lead on Chip) 構造にし て封止材との密着性を向上させる手法が用いられている が、高コスト化、効果が不十分等の問題がある。さら に、LOC構造の場合、パッケージ表面の色むらが生じ 外観を損ねる。また、半導体装置等の電子部品装置の小 型化、多ピン化に伴い、インナーリード間やパッド間、 ワイヤー間などピッチ間距離が狭くなってきており、封 止材中に含まれるカーボンブラック等の導電性物質が大 きな粗粒として存在する場合には、インナーリード間や パッド間そしてワイヤー間に導電性であるカーボンブラ ックが狭まり、電気特性不良に至ってしまう。このた め、着色剤としてカーボンブラックの代わりに有機染料 や顔料等を用いる検討がなされている(特開昭63-1

79921号公報、特開平11-60904号公報)が、YAGレーザーマーク性の低下、信頼性の低下、高コスト化等の問題があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる状況に鑑みてなされたもので、レーザーマーク性や電気特性に優れ、パッド間やワイヤー間距離が狭い半導体装置等の電子部品装置においても、導電性物質によるショート不良が発生せず、かつ成形性、信頼性、パッケージ表面の外観に優れた封止用エポキシ樹脂組成物及びこれにより封止した素子を備えた電子部品装置を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記の課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、封止用エポキシ樹脂組成物に非導電性カーボンを配合することにより上記の目的を達成しうることを見い出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、

- (1) (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤、(C) 非導電性カーボン及び(D) 無機充填材を必須成分とする封止用エポキシ樹脂組成物、
- (2) 非導電性カーボンの電気抵抗が 1 0⁷ Ω以上である上記 (1) 記載の封止用エポキシ樹脂組成物、及び
- (3) 非導電性カーボンの含有量が、樹脂組成物全体の 0.1~10重量%である上記(1)又は(2)記載の 封止用エポキシ樹脂組成物、並びに
- (4)上記(1)~(3)のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂組成物により封止された素子を備えた電子部品装置に関する。

30 [0005]

【発明の実施の形態】本発明において用いられる(A) エポキシ樹脂としては特に制限はないが、例えば、封止 用エポキシ樹脂組成物で一般に使用されている、フェノ ールノボラック型エポキシ樹脂、オルソクレゾールノボ ラック型エポキシ樹脂、ピスフェノールAノボラック型 エポキシ樹指をはじめとするフェノール類とアルデヒド 類から合成されるノボラック樹脂をエポキシ化したエポ キシ樹脂、アルキル置換又は非置換のピフェノール型エ ポキシ樹脂、アルキル置換又は非置換のグリシジルエー テル型エポキシ樹脂、イソシアヌル酸等のポリアミンと 40 エピクロルヒドリンの反応により得られるグリシジルア ミン型エポキシ樹脂、ピフェニル型エポキシ樹脂、ジシ クロペンタジエンとフェノール類及び/又はナフトール 類の共縮合樹脂のエポキシ化物、ナフタレン環を有する エポキシ樹脂、フェノール・アラルキル樹脂、ナフトー ル・アラルキル樹脂等のアラルキル型フェノール樹脂の エポキシ化物、トリメチロールプロパン型エポキシ樹 脂、テルペン変性エポキシ樹脂、オレフィン結合を過酢 酸等の過酸で酸化して得られる線状脂肪族エポキシ樹 50 脂、脂環族エポキシ樹脂などが挙げられ、これらは単独

で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。

*いずれかにより示される化合物などが挙げられる。

【0006】具体的には、下記一般式 (I)~ (IV)の*

には、下記一般式(I)~(IV)の* 【化1】
$$CH_2\text{-}CHCH_2\text{-}O = \begin{bmatrix} R^1 & R^2 & R^$$

(ここで、R¹~R¹は水素原子及び炭素数1~10の置 ※す。) 換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、全てが同 【化2】

ーでも異なっていてもよい。nは0~3の整数を示 ※

(ここで、 R^{12} は水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の \bigstar す。) 置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、全てが 【化3】 同一でも異なっていてもよい。nは $0\sim3$ の整数を示 \bigstar

(ここで、R¹³~R¹⁶は水素及び炭素数1~10の置換 ☆す。)又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、すべて同一 【化4】でも異なっていてもよい。nは0~10の整数を示 ☆

30

(ここで、R は水素及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、n は $0\sim10$ の整数を示す。)

【0007】上記一般式(I)中のR¹~R¹は、水素原 子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソ プロビル基、イソブチル基等のアルキル基、メトキシ 基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等のアルコ キシル基、フェニル基、トリル基、キシリル基等のアリ ール基、ベンジル基、フェネチル基等のアラルキル基、 メトキシメチル基、エトキシメチル基メトキシエチル基 等のアルコキシアルキル基、アミノメチル基、アミノエ チル基等のアミノ基置換アルキル基などの炭素数1~1 0の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれる が、中でも水素原子又はメチル基が好ましい。上記一般 式(I)で示されるピフェニル型エポキシ樹脂として は、4,4'-ビス(2,3-エポキシプロポキシ)ビ フェニル又は4,4'-ピス(2,3-エポキシプロポ を主成分とするエポキシ樹脂、エピクロルヒドリンと 4, 4'-ピフェノール又は 4, 4'-(3, 3',5,5'-テトラメチル)ピフェノールとを反応させて 得られるエポキシ樹脂等が挙げられ、中でも、4,4%

ービス(2,3ーエポキシプロポキシ)-3,3', 5,5'ーテトラメチルビフェニルを主成分とするエポキシ樹脂がより好ましい。

【0008】上記一般式 (II) 中のR5~R12は、水素 原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イ ソプロピル基、イソブチル基等のアルキル基、メトキシ 基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等のアルコ キシル基、フェニル基、トリル基、キシリル基等のアリ ール基、ベンジル基、フェネチル基等のアラルキル基、 メトキシメチル基、エトキシメチル基メトキシエチル基 等のアルコキシアルキル基、アミノメチル基、アミノエ チル基等のアミノ基置換アルキル基などの炭素数1~1 0の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれる が、中でも水素原子又はメチル基が好ましい。上記一般 式(II)で示されるピスフェノールF型エポキシ樹脂と しては、例えば、R⁵、R⁷、R¹⁰及びR¹¹がメチル基 で、R⁶、R⁹、R⁹及びR¹¹が水素原子であり、n=0 を主成分とするESLV-80XY(新日鉄化学株式会 社製商品名)が市販品として入手可能である。

【0009】上記一般式 (III) 中のR¹³~R¹⁶は、水 素原子、メチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビ 50 ル基、n-ブチル基、t-ブチル基、アミル基、イソブ

チル等のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポ キシ基、ブトキシ基等のアルコキシル基、フェニル基、 トリル基、キシリル基等のアリール基、ベンジル基、フ ェネチル基等のアラルキル基、メトキシメチル基、エト キシメチル基メトキシエチル基等のアルコキシアルキル 基、アミノメチル基、アミノエチル基等のアミノ基置換 アルキル基などの炭素数1~10の置換又は非置換の一 価の炭化水素基から選ばれるが、中でもアルキル基が好 ましく、メチル基又はセーブチル基がより好ましい。上 記一般式 (III) で示されるフェニルスルフィド型エポ キシ樹脂としては、入手性及び流動性の観点から、R13 及びR'「がt-ブチル基で、R''及びR'「がメチル基 で、nが0である化合物を主成分とするピス(2-メチ ルー4-ヒドロキシー5-t-ブチル) チオエーテルの エポキシ化物が好ましい。

【0010】上記一般式(IV)中のRとしては、例え ば、水素、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル 基、イソプロピル基、 t - ブチル基等のアルキル基、ビ ニル基、アリル基、ブテニル基等のアルケニル基、ハロ ゲン化アルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプ ト基置換アルキル基などの炭素数1~10の置換又は非 置換の一価の炭化水素基が挙げられ、中でもメチル基、 エチル基等のアルキル基が好ましく、メチル基がより好 ましい。上記一般式 (IV) で示されるノボラック型エポ キシ樹脂としては、フェノールノボラック型エポキシ樹 脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂等が挙 げられ、中でもオルソクレゾールノボラック型エポキシ 樹脂が好ましい。

【0011】本発明において用いられる(B)硬化剤と しては特に制限はないが、例えば、封止用エポキシ樹脂 組成物で一般に使用されているもので、フェノール、ク レゾール、レゾルシン、カテコール、ピスフェノール A、ビスフェノールF等のフェノール類及び/又は α -ナフトール、βーナフトール、ジヒドロキシナフタレン 等のナフトール類とホルムアルデヒド等のアルデヒド類 とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られる樹脂、 フェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル 樹脂等のアラルキル型フェノール樹脂などが挙げられ、 これらは単独で用いても2種以上を組み合わせて用いて もよい。

(B) 硬化剤は、上記(A) エポキシ樹脂のエポキシ基 当量に対して、フェノール水酸基当量が0.5~1.5当 量となる量で配合されることが好ましく、より好ましく は0.8~1.2当量で配合される。0.5当量未満では エポキシ樹脂の硬化が不十分となり、硬化物の耐熱性、 耐湿性並びに電気特性が劣る傾向があり、1.5 当量を 超えると硬化剤成分が過剰になり硬化樹脂中に多量のフ ェノール性水酸基が残るため、電気特性並びに耐湿性が 悪くなる傾向がある。

【0012】本発明の封止用エポキシ樹脂組成物には、

エポキシ基とフェノール性水酸基とのエーテル化反応を 促進するため、硬化促進剤を配合することが好ましい。 硬化促進剤としては、エポキシ樹脂と硬化剤の反応を促 進させるような触媒機能を持つ化合物であれば特に制限 はないが、例えば、1,8-ジアザービシクロ(5,4, 0) ウンデセンー7、1,5-ジアザービシクロ(4, (3,0) ノネン、(5,6) -ジプチルアミノ(-1,8) -ジア ザービシクロ(5,4,0)ウンデセンー7、ベンジルジ メチルアミン、トリエタノールアミン、ジメチルアミノ エタノール、トリス (ジメチルアミノメチル) フェノー 10 ル等の3級アミン類及びこれらの誘導体、2-メチルイ ミダゾール、2-フェニルイミダゾール、2-フェニル - 4-メチルイミダゾール等のイミダゾール類及びこれ らの誘導体、トリブチルホスフィン、メチルジフェニル ホスフィン、トリフェニルホスフィン、ジフェニルホス フィン、フェニルホスフィン等の有機ホスフィン類及び これらのホスフィン類に無水マレイン酸、ベンゾキノ ン、ジアゾフェニルメタン等のπ結合をもつ化合物を付 加してなる分子内分極を有するリン化合物、テトラフェ ニルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリフェニ ルホスフィンテトラフェニルボレート、2-エチルー4 ーメチルイミダゾールテトラフェニルボレート、N-メ チルテトラフェニルホスホニウムーテトラフェニルボレ ート、トリフェニルホスホニウムートリフェニルボラン 等が挙げられ、これらは単独で用いても2種以上を組み 合わせて用いてもよい。硬化促進剤の配合量は、エポキ シ樹脂100重量部に対して0.01~5重量部が好ま しく、0.1~3重量部を配合するのがより好ましい。 0.01重量部より少ないと促進効果が小さく、5重量 30 部より多いと保存安定性が悪くなる傾向にある。

【0013】本発明において用いられる(C)非導電性 カーボンとしては特に制限はないが、例えば、ポリマー を焼成させて得られる非導電性ポリマー焼成カーボン、 カーポンプラックの表面にポリマーをグラフトさせて得 られるグラフトカーボン、カーボンブラックの表面をシ リカ等の絶縁無機物で覆うことによって得られるカーボ ン内包フィラー、酸化処理等の表面処理を施したカーボ ンブラックなどが挙げられ、これらは単独で用いても2 種以上を組み合わせて用いてもよい。また、これらの非 導電性カーボンをエポキシ樹脂、フェノール樹脂等でコ 40 ートして用いることもできる。非導電性ポリマー焼成カ ーポンの製造法には特に制限はないが、例えば、ナフタ レン等の芳香族を有するスルホン酸ポリマーなどのポリ マーを400~600℃で焼成する方法が挙げられる。 グラフトカーボンの製造法には特に制限はないが、例え ば、エポキシ基、チオエポキシ基、アジリジン基、オキ サゾリン基、イソシアネート基等のカーボンブラック表 面のカルボキシル基と反応性を有する基を有するグラフ トポリマーを、熱によりカーボンブラックに不可逆的付 50 加反応させる方法が挙げられる。ここで用いられるグラ

フトポリマーとしては特に制限はないが、上記の反応性 基を有する不飽和化合物をそれと共重合可能な単量体と **共重合させて得られるもので、例えば、ポリスチレン、** ポリエチレングリコール、ポリオキサゾリン、ポリプロ ピレングリコール、ポリメタクリル酸メチル、アクリル 樹脂、フッ素樹脂等及びこれらの誘導体、ポリジメチル シロキサン等のシリコーン、ワックスなどが挙げられ、 これらは単独で用いても2種以上を組み合わせて用いて もよい。グラフトカーボンに用いられるカーボンブラッ クとしては特に制約はないが、グラフトポリマーとの反 応点であるカルボキシル基等の酸性官能基が表面に多く 存在するものが好ましく、p Hが7以下のカーボンブラ ックがより好ましい。グラフトカーボンのグラフト率は 非導電性の観点から30重量%以上が好ましく、50重 量%以上がより好ましい。ここで、グラフト率とはグラ フトカーボン全体に占めるグラフトポリマーの割合をさ す。カーボン内包フィラーの製造法には特に制限はない が、例えば、水溶液中に分散させたカーボンブラックの 表面に、テトラエトキシシランを加水分解させることに よってシリカ微粒子を沈着させる方法、水溶液中に分散 させたカーボンブラックにシリカゾルを添加しゾルゲル 法によってシリカ微粒子を沈着させる方法等が挙げられ る。カーボンブラックの表面を覆う絶縁無機物としては 特に制限はないが、例えば、炭酸カルシウム、炭酸バリ ウム等のアルカリ土類金属炭酸塩、珪酸カルシウム、珪 酸マグネシウム等のアルカリ土類金属珪酸塩、酸化鉄、 シリカ、アルミナ、酸化銅、酸化コバルト、酸化ニッケ ル等の金属酸化物、炭酸コバルト、炭酸ニッケル、塩基 性炭酸銅、水酸化アルミニウム、ダイレクトブラック1 5 4 カルシウムレーキなどが挙げられ、これらは単独で 用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。カーボ ン内包フィラーに用いられるカーボンブラックとしては 特に制限はないが、水に濡れやすく、かさ高くないもの が好ましい。カーボン内包フィラーのカーボン内包率 は、非導電性の観点から70重量%以下が好ましく、5 0重量%以下がより好ましい。ここで、カーボン内包率 とは、カーポン内包フィラー全体に占めるカーボンブラ ックの割合をさす。表面処理を施したカーボンブラック の製造法としては、特に制限はないが、例えば、空気酸 化法、硝酸、窒素酸化物と空気の混合ガス、オゾン等の 40 酸化剤を用いる酸化処理法、シランカップリング剤を用 いる方法等でカーボンブラックを表面処理する方法など が挙げられる。

【0014】(C) 非導電性カーボンの電気抵抗は、 $10^7\Omega$ 以上が好ましく、 $10^9\Omega$ 以上がより好ましい。電気抵抗は、JISZ3197に準拠した、ガラス布基材エポキシ樹脂銅張積層板MCL-E67(日立化成工業株式会社製商品名)を基板とした2形のくし型電極(銅箔厚 35μ m、線幅0.3mm、線間0.3mm、基板厚0.95mm)を用い、粉末サンブル0.5gを配線

上にセロハンテープで固定し、抵抗計(タケダ理研工業株式会社製TR8601)により直流500Vで1分後の抵抗値を測定することにより求められる。

- (C) 非導電性カーボンの平均粒径は、 $0.3\sim50\mu$ mが好ましく、 $0.3\sim30\mu$ mがより好ましい。レーザーマーク性、成形性の観点からは $0.3\sim10\mu$ mが好ましく、 $0.3\sim5\mu$ mがより好ましい。
- (C) 非導電性カーボンの含有量は、封止用エポキシ樹脂組成物全体に対し0.1~10重量%が好ましく、
- 0.3~8重量%がより好ましく、0.5~4重量%がさらに好ましい。0.1重量%未満ではパッケージ表面の外観が損なわれたり、遮光性、レーザーマーク性が不十分となったりする場合があり、10重量%を超えると成形性が不十分となる傾向がある。

【0015】充填材としては、吸湿性低減及び強度向上 の観点から無機充填材を用いることが必要である。本発 明に用いられる(D)無機充填材としては特に制限はな いが、例えば、封止用エポキシ樹脂組成物で一般に使用 されているもので、溶融シリカ、結晶シリカ、アルミ ナ、ジルコン、珪酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭化 珪素、窒化ホウ素、ベリリア、ジルコニア等の粉体、又 はこれらを球形化したビーズ、チタン酸カリウム、炭化 珪素、窒化珪素、アルミナ等の単結晶繊維、ガラス繊維 などが挙げられ、これらは単独で用いても2種以上を組 み合わせて用いてもよい。また、難燃効果のある無機充 填材としては水酸化アルミニウム、棚酸亜鉛等が挙げら れ、これらは単独で用いても併用してもよい。中でも、 線膨張係数低減の観点からは溶融シリカが、高熱伝導性 の観点からはアルミナが好ましく、無機充填材の形状 は、成形時の流動性及び金型摩耗性の点から球形が好ま しい。

(D)無機充填材の配合量としては、吸湿性、線膨張係数の低減、強度向上及び半田耐熱性の観点から、封止用エポキシ樹脂組成物全体に対し70~98重量%が好ましい。より好ましくは、75~95重量%の範囲である。

【0016】本発明の封止用エポキシ樹脂組成物には、 無機充填材と樹脂成分との親和性をはかる観点からはカップリング剤を添加することが好ましい。用いられるカップリング剤としては特に制限はなく、例えば、封止用エポキシ樹脂組成物で一般に使用されているもので、ピニルトリクロロシラン、ビニルトリエトキシシラン、アーメタクリロキシプロビルトリメトキシシラン、 β -(3,4-エポキシジシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、アーグリシドキシプロビルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、アーメルカプトプロビルトリメトキシシラン、アー「ピス(β -ヒドロキシエチル)]アミノブロビルトリエトキシシラン、アー「ピス(β -ヒドロキシエチル)]アミノブロビルトリエトキシシラン、 γ - β -(アミノエチル)

アミノエチル) アミノプロピルジメトキシメチルシラ ン、N-(トリメトキシシリルプロピル)エチレンジア ミン、N-(ジメトキシメチルシリルイソプロピル) エ チレンジアミン、メチルトリメトキシシラン、メチルト リエトキシシラン、、N-β- (N-ビニルベンジルア ミノエチル) - γ - アミノプロピルトリメトキシシラ ン、γ-クロロプロピルトリメトキシシラン、ヘキサメ チルジシラン、γーアニリノプロピルトリメトキシシラ ン、ピニルトリメトキシシラン、アーメルカプトプロビ ルメチルジメトキシシラン等のシラン系カップリング 剤、イソプロビルトリイソステアロイルチタネート、イ ソプロビルトリス (ジオクチルパイロホスフェート) チ タネート、イソプロピルトリ (N-アミノエチルーアミ ノエチル) チタネート、テトラオクチルビス (ジトリデ シルホスファイト) チタネート、テトラ(2,2-ジア リルオキシメチルー1-ブチル)ピス(ジトリデシル) ホスファイトチタネート、ピス (ジオクチルパイロホス フェート) オキシアセテートチタネート、ピス (ジオク チルパイロホスフェート) エチレンチタネート、イソプ ロピルトリオクタノイルチタネート、イソプロビルジメ タクリルイソステアロイルチタネート、イソプロビルト リドデシルベンゼンスルホニルチタネート、イソプロピ ルイソステアロイルジアクリルチタネート、イソプロビ ルトリ (ジオクチルホスフェート) チタネート、イソプ ロピルトリクミルフェニルチタネート、テトライソプロ ピルビス (ジオクチルホスファイト) チタネート等のチ タネート系カップリング剤などが挙げられ、これらは単 独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。

【0017】その他の添加剤として、高級脂肪酸例えば 30 カルナパワックスとポリエチレン系ワックス等の離型 材、シリコーンオイル、シリコーンゴム等の改質材、ハ イドロタルサイト、アンチモンーピスマス等のイオント ラッパーなどを必要に応じて、それぞれ単独で又は2種 以上を組み合わせて配合することができる。また、本発 明の封止用エポキシ樹脂組成物には、本発明の効果が達 成される範囲内であれば、非導電性カーボン以外に、ア ジン系染料、アントラキノン系染料、ジスアゾ系染料、 ジイミニウム系染料、アミニウム系染料、ジイモニウム 系染料、Cr錯体、Fe錯体、Co錯体、Ni錯体、F e, Cu、Ni等の金属化合物、Al, Mg, Fe等の 金属酸化物、雲母、近赤外吸収材、フタロシアニン系顔 料、フタロシアニン系染料、カーボンブラックなどの着 色剤を1種又は2種以上併用することができる。特に、 レーザーマーク性、流動性、硬化性の点からはフタロシ アニン系染料を併用することが好ましい。カーボンブラ ック等の導電性粒子を併用する場合には、本発明の目的 を達成するために、分散性に優れる、比表面積が130 m¹/g以下、DBP吸油量が120cm³/100g以 下のものが好ましく、比表面積が100m1/g以下、

DBP吸油量が80cm3/100g以下のものがより 好ましい。

【0018】本発明の封止用エポキシ樹脂組成物は、上 記各原材料を均一に分散混合できるのであれば、いかな る手法を用いても調製できるが、一般的な方法として は、所定の配合量の原材料をミキサー等によって充分混 合した後、熱ロール、押出機等によって混練し、冷却、 粉砕する方法を挙げることができる。成形条件に合うよ うな寸法及び重量でタブレット化すると使いやすい。 【0019】本発明の封止用エポキシ樹脂組成物は、レ ーザーマーク性、電気特性に優れ、且つ成形性、信頼 性、スケルトン防止に優れており、IC、LSI等の封 止に好適に用いることができる。本発明で得られる封止 用エポキシ樹脂組成物により封止した素子を備えた電子 部品装置としては、リードフレーム、配線済みのテープ キャリア、配線板、ガラス、シリコンウエハ等の支持部 材に、半導体チップ、トランジスタ、ダイオード、サイ リスタ等の能動素子、コンデンサ、抵抗体、コイル等の 受動素子等の素子を搭載し、必要な部分を本発明の封止 用エポキシ樹脂組成物で封止した、電子部品装置などが 挙げられる。このような電子部品装置としては、例え ば、リードフレーム上に半導体素子を固定し、ボンディ ングパッド等の素子の端子部とリード部をワイヤボンデ ィングやバンプで接続した後、本発明の封止用エポキシ 樹脂組成物を用いてトランスファ成形などにより封止し てなる、DIP (Dual InlinePackage)、PLCC (Pl astic Leaded Chip Carrier) , QFP (Quad Flat Pac kage) 、SOP (Small Outline Package) 、SOJ (S mall Outline J-lead package) , TSOP (Thin Smal 1 Outline Package) , TQFP (Thin Quad Flat Pack age) 等の一般的な樹脂封止型IC、テープキャリアに バンプで接続した半導体チップを、本発明の封止用エポ キシ樹脂組成物で封止したTCP (Tape Carrier Packa ge) 、配線板やガラス上に形成した配線に、ワイヤーボ ンディング、フリップチップボンディング、はんだ等で 接続した半導体チップ、トランジスタ、ダイオード、サ イリスタ等の能動素子及び/又はコンデンサ、抵抗体、 コイル等の受動素子を、本発明の封止用エポキシ樹脂組 成物で封止したCOB (ChipOn Board) モジュール、ハ イブリッドIC、マルチチップモジュール、裏面に配線 板接続用の端子を形成した有機基板の表面に素子を搭載 し、バンプまたはワイヤボンディングにより素子と有機 基板に形成された配線を接続した後、本発明の封止用エ ポキシ樹脂組成物で素子を封止したBGA (Ball Grid Array)、CSP (Chip Size Package) などが挙げられ る。また、プリント回路板にも本発明の封止用エポキシ 樹脂組成物は有効に使用できる。本発明で得られる封止 用エポキシ樹脂組成物を用いて電子部品装置を封止する 方法としては、低圧トランスファー成形法が最も一般的 50 であるが、インジェクション成形、圧縮成形、注型等の

方法を用いてもよい。

[0020]

【実施例】以下に本発明を実施例により詳細に説明する が、本発明はこれに限定されるものではない。

実施例1~9、比較例1~4

まず、表1及び表2に示す配合成分を予備混合(ドライ*

*ブレンド) した後、二軸ロール (ロール表面温度80 ℃)で10分間混練し、冷却粉砕して実施例及び比較例 の封止用エポキシ樹脂組成物を製造した。

12

[0021]

【表1】

表 1 配合組成 1							(配合:	量:重	(金色)	
配合成分	実施例									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ビフェニル型エポキシ樹脂	85 . 0	85. 0	85.0	85.0	85 . 0	85 . 0	85.0	85.0	85. 0	
臭素化エポキシ樹脂	15.0	15. 0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15. 0	
アラルキル型フェノール樹脂	87. 0	87. 0	87. 0	87. 0	87. 0	87. O	87.0	87.0	87. 0	
トリフェニルホスフィン	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	3.0	3. 0	3. 0	3. 0	3. 0	
エポキシシラン	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	
カルナパワックス	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	1.5	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	
ポリエチレンワックス	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	1. 5	1, 5	
非導電性カーボンA	55.0	_		20.0	20.0	10.0	-	_	30, 0	
非導電性カーボンB	_	60.0	_		30.0	20. D	-	_	-	
非導電性カーボンC	_		65, 0	_	_	30, 0		-	_	
非導電性カーボンD	_		_	_	_	_	50.0	-	_	
非導電性カーボンE	-	-	ı	1	-	•	_	30.0		
カーボンブラックA			_	2.0	-			_	_	
フタロシアニン系染料		-	_	-	_			-	1, 0	
三酸化アンチモン	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
溶融シリカ	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	

[0022]

【表2】

表2 配合組成2		(配合	量:重	量部)			
配合成分		比較例					
RC 172.73	1	2	3	4			
ビフェニル型エポキシ樹脂	85.0	85.0	85, 0	85. 0			
臭素化エポキシ樹脂	15, 0	15, 0	15, 0	15.0			
アラルキル型フェノール樹脂	87.0	87.0	87.0	87.0			
トリフェニルホスフィン	3, 0	3, 0	3, 0	3. 0			
エポキシシラン	7. 6	7. 6	7.6	7. 6			
カルナパワックス	1.5	1.5	1.5	1. 5			
ポリエチレンワックス	1.5	1. 5	1.5	0. 5			
カーボンブラックB	3, 5	1, 5	_	- 7			
アジン系染料	-	10.0	35, 0				
雲母-黒酸化鉄系染料		-	-	30.0			
三酸化アンチモン	12	12	12	15			
溶融シリカ	1550	1550	1550	1550			

【0023】なお、表1及び表2記載の配合成分は次の 通りである。

ピフェニル型エポキシ樹脂:油化シェルエポキシ株式会 社製商品名YX-4000H

臭素化エポキシ樹脂:東都化成株式会社製商品名YDB

アラルキル型フェノール樹脂:三井化学株式会社製商品 40 名XL-225-3L

エポキシシラン:日本ユニカー株式会社製商品名A-1 8 7

ポリエチレンワックス:クラリアントジャパン株式会社 製商品名PED-191

非導電性カーボンA:三井鉱山株式会社製商品名CB-3-500 (平均粒径3μm、電気抵抗10°Ω)

非導電性カーボンB:三井鉱山株式会社製商品名CB-7-500 (平均粒径7μm、電気抵抗10°Ω)

10-500 (平均粒径10μm、電気抵抗10⁹Ω)

非導電性カーボンD:スチレン/アクリル系グラフトポ リマーを用いたグラフト率90重量%のグラフトカーボ ン (株式会社日本触媒製、電気抵抗1010Ω)

非導電性カーボンE:カーボン内包率17重量%のカー ボン内包シリカ (鈴木油脂工業株式会社製、平均粒径7 μm、電気抵抗 10°Ω)

カーボンブラックA:比表面積89m¹/g、DBP吸 油量60cm3/100gのカーボンブラック

30 カーボンブラックB: 比表面積 1 4 0 m¹ / g、DBP 吸油量131cm3/100gのカーボンブラック フタロシアニン系染料:山本化成株式会社製商品名 Y K R - 3080

アジン系染料: 住友化学工業株式会社製商品名スピリッ トブラック920

雲母-黒酸化鉄系染料:メルクジャパン株式会社製商品 名LS835

溶融シリカ:マイクロン株式会社製商品名S-CO

【0024】実施例、比較例の封止用エポキシ樹脂組成 物を次に示す各試験により評価した。なお、封止用エポ キシ樹脂組成物の成形は、トランスファ成形機を用い、 金型温度180℃、成形圧力6.9MPa、硬化時間9 0秒の条件で行なった。また、後硬化 (ポストキュア) は175℃で6時間行った。

(1) スパイラルフロー

EMM11-66に準じた金型をトランスファ成形機に セットし、上記条件で封止用エポキシ樹脂組成物を成形 し、流動距離 (cm)を求めた。

(2) 熱時硬度

非導電性カーボンC:三井鉱山株式会社製商品名CB- 50 バリ測定金型(幅5mm、深さ50、30、20、1

0、5、 2μ mのスリットを設けた金型)をトランスフ ア成形機にセットし、上記条件で封止用エポキシ樹脂組 成物を成形し、金型開放10秒後、樹脂溜り部分をショ ア硬度計にて測定した。

(3) 体積抵抗率

円板金型をトランスファ成形機にセットし、封止用エポ キシ樹脂組成物を上記条件で直径100mm、厚さ3m mの円板に成形し後硬化した後、体積抵抗計を用いて、 電圧500√、150℃で測定し、絶縁性を確認した。

(4) 耐湿性

耐湿性に用いた電子部品装置はSOP-28ピンのSO P28ピンの樹脂封止型半導体装置(外形寸法18× 8. 4×2 . 6 mm) 7 cm 7 cm $8 \cdot 4 \times 2$. 1 cmロイ材 (加工ディンプル) で9.6×5.1mmのTE Gチップ (A1配線10及び20ミクロン幅、ギャップ 10及び20ミクロン、パッシベーションなし)を有す るもので、上記条件でトランスファ成形、後硬化を行っ て作製した。85℃/85RH%で72時間吸湿した 後、240℃/10秒 (IRリフロー) の前処理後、P の断線の有無を確認し、断線パッケージが試験パッケー ジ中50%に達するまでのPCT処理時間で評価した。

(5) 半田耐熱性

半田耐熱性に用いた電子部品装置は、QFP-80ピン の樹脂封止型半導体装置(外形寸法20×14×2.0 **) mm) であり、リードフレームは42アロイ材 (加工な* *し)で8x10mmのチップサイズを有するもので、上 記条件でトランスファ成形、後硬化を行って作製した。 このようにして得られた樹脂封止型半導体装置を、85 °C/85RH%で所定の時間吸湿した後、240°C/1 0秒の処理を行なった時のクラック発生を観察し、外観 クラックが発生するまでの吸湿時間により半田耐熱性を 評価した。

(6) レーザーマーク性

レーザーマーク性評価に用いた電子部品装置は、QFP 10 -54ピンの樹脂封止型半導体装置であり、パッケージ 表面をYAGレーザーマーキング装置で、YAGレーザ 一波長1064nm、レーザーパワー5Jの条件で印字 し、目視でマーク性を評価した。

(7) 電気特性

電気特性の評価に用いた電子部品装置は、LQFP (Lo wprofile Quad Flat Package) 176ピンの樹脂封止型 半導体装置であり、リーク電流の有無で評価した。

(8) 黒色度

黒色度は、円板金型をトランスファ成形機にセットし、 CT処理 (121 C / 0 .2 MP a) してチップ上配線 20 封止用エポキシ樹脂組成物を上記条件で表面が梨地であ る直径100mm、厚さ2mmの円板に成形し後硬化し た後、色差計にて測定した。黒色度は値が小さいほど黒 色を示す。上記の試験結果を表3及び表4に示す。

[0025]

【表3】----

表る	評価結果	1

						·						
項目	単位	実施例										
グロ		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
スパイラルフロー	cm	84	89	94	99	97	94	81	84	94		
熱時硬度	_	80	80	81	80	81	81	80	81	81		
体積抵抗率	Ω·cm	6X 10 ¹³	7X10 ¹³	6X10 ¹³	1X10 ¹³	5X10 ¹³	4X 10 ¹³	1X10 ¹³	5X10 ¹³	4X10 ¹³		
耐湿性	h	650	650	600	720	600	650	650	600	650		
半田耐熱性	h	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
レーザーマーク性	1	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好		
電気特性(リーク電流の有無)	-	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
黒色度	1	26. 4	28.9	29.5	26.5	27. 6	28. 7	28. 2	28.3	27. 9		
総合判定	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[0026]

【表4】

表 4 評価結果 2							
項目	単位	比較例					
グロ		1	2	3	4		
スパイラルフロー	cm	97	89	64	76		
熱時硬度	_	81	80	79	80		
体積抵抗率	$\Omega \cdot cm$	3X10 ¹³	9X10 ¹¹	8X10 ¹¹	8X10 ¹⁰		
耐湿性	h	650	310	240	600		
半田耐熱性	h	120	96	48	96		
レーザーマーク性	_	良好	良好	良好	良好		
電気特性(リーク電流の有無)	_	有	無	無	有		
黒色度	_	27.8	28. 2	28.5	28. 2		
総合判定	_	×	×	×	×		

【0027】本発明の着色剤として非導電性カーボンを 50 用いていない比較例1~4は、いずれも満足な特性が得

られない。すなわち、導電性のカーボンブラックを用いた比較例1は電気特性に劣り、アジン系染料を用いた比較例2、3は耐湿性及び半田耐熱性に劣る。雲母ー黒酸化鉄系染料を用いた比較例4は半田耐熱性及び電気特性に劣る。これに対して、実施例1~9は、耐湿性、半田耐熱性等の信頼性及び電気特性に優れ、レーザマーク性、黒色度も良好である。

[0028]

【発明の効果】本発明になる封止用エポキシ樹脂組成物は、実施例に示したように成形性が良好で、レーザーマーク性、電気特性、信頼性、パッケージ表面の外観に優れる電子部品装置が得られるので、その工業的価値は大である。。

16

フロントページの続き

Fターム(参考) 4J002 CC03X CC04X CC05X CC06X

CDOOW CDO1W CDO2W CDO5W

CD06W CD14W CE00X DA036

DE097 DE147 DE187 DE237

DJ007 DJ017 DK007 DL007

FA047 FA087 FB076 FB107

FB117 FB137 FB147 FB157

FB167 FB177 FB207 FB217

FB266 FD017 FD090 FD126

FD14X FD150 FD160 GQ05

4M109 AA01 CA01 CA21 CA22 EA03

EA04 EA05 EB03 EB04 EB06

EB07 EB08 EB09 EB12 EB13

EB18-EB19-EC07-EC13-EC20